INFORMATION
SCIENCE
TECHNICAL
REPORT

NAIST-IS-TR99006
ISSN 0919-9527

Universal Test Complexity of Field-Programmable Gate Arrays

Tomoo Inoue, Hideo Fujiwara,
Hiroyuki Michinishi, Tokumi Yokohira,
and Takuji Okamoto

April 1999

NAIST

〒 630-0101
奈良県生駒市高山町 8916-5
奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科

Graduate School of Information Science
Nara Institute of Science and Technology
8916-5 Takayama, Ikoma, Nara 630-0101, Japan